

⑬ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平3-288909

⑤ Int. Cl.<sup>5</sup>

G 05 B 19/403  
19/405

識別記号

C  
P

庁内整理番号

9064-3H  
9064-3H

⑬ 公開 平成3年(1991)12月19日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 自動プログラム作成装置

⑮ 特 願 平2-91603

⑯ 出 願 平2(1990)4月5日

⑰ 発 明 者 澤 田 美 穂 子 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目3番1号 松下通信工業株式会社内

⑱ 発 明 者 城 代 博 道 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目3番1号 松下通信工業株式会社内

⑲ 出 願 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

⑳ 代 理 人 弁理士 森本 義弘

明 細 書

1 発明の名称

自動プログラム作成装置

2 特許請求の範囲

1 CAD装置より入力した、二次元CAD情報に指示された測定対象物の輪郭測定位置と測定条件データをもとに、CNC三次元測定機のプローブの進入方向、進入位置、アプローチ位置を演算して移動軌跡データを求め、CNC三次元測定機で自動輪郭測定を行うパートプログラムを作成する手段と、前記移動軌跡データに基づいて前記パートプログラムの移動軌跡を前記CNC三次元測定機でシミュレーションするテストプログラムを作成する手段からなる自動プログラム作成装置。

3 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は製作物の評価、検証に用いる三次元測定を、効率的に行わせるための輪郭測定用自動プログラム作成装置に関するものである。

従来の技術

CNC(Computer Numerical Control)三次元測定機で測定対象物の曲面形状の仕上り状態を知るために、断面輪郭を点列で測定する輪郭測定を行なっている。従来、この測定は手動入力により輪郭に沿ってCNC三次元測定機のプローブを動かし、個々に測定条件を指定して前記点列データを取り込むものであった。

発明が解決しようとする課題

しかし、上記従来の手動による測定では、常に人が三次元測定機についた状態で測定が行われていたため、効率的な移動が得られず、さらに、測定に時間がかかるため、多量の測定データを必要とする正確な測定ができないという問題があった。

本発明はこのような従来の問題を解決するものであり、三次元測定機での測定手順を自動作成し、長時間無人測定を実現し、正確な測定を可能とする自動プログラム作成装置を提供することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

上記課題を解決するため本発明の自動プログラム作成装置は、C A D装置より入力した、二次元C A D情報に指示された測定対象物の輪郭測定位置と測定条件データをもとに、C N C三次元測定機のプローブの進入方向、進入位置、アプローチ位置を演算して移動軌跡データを求め、C N C三次元測定機で自動輪郭測定を行うパートプログラムを作成する手段と、前記移動軌跡データに基づいて前記パートプログラムの移動軌跡を前記C N C三次元測定機でシミュレーションするテストプログラムを作成する手段からなるものである。

作用

上記構成により、測定対象物の二次元C A D情報に指示された測定対象物の輪郭測定位置と測定条件データをもとに、C N C三次元測定機で自動的に輪郭測定を行うパートプログラムと、このパートプログラムの移動軌跡を実機によりシミュレーションし、データの安全性を確認するテストプログラムとが短時間で自動的に作成される。

実施例

テストプログラム5を作成する。これら2つのプログラム4、5で三次元測定機6において測定対象物7の自動輪郭測定およびシミュレーションが行われる。

M I C R O・C A D A M Iに書かれた測定対象物7の輪郭測定位置と測定条件データの一例を説明する。

第2図はM I C R O・C A D A M Iに書かれたX-Y座標平面図に測定条件、測定位置を示したものである。それぞれの開始点 $D_1$ 、 $D_2$ 、 $D_3$ と終了点 $E_1$ 、 $E_2$ 、 $E_3$ を直線 $L_1$ 、 $L_2$ 、 $L_3$ でむすび測定点を関連付けた測定位置を示す。

開始点Dに終了座標の値を示し、終了点Eに進入方向、平面、終了条件をつけている。たとえば、終了点 $E_1$ には、プローブの進入方向がY座標のプラス側(Y+)、測定平面がXY平面(XY)、終了条件として $X=60$ (開始点 $D_1$ の値)が2回でくると終了する(2、X)ことが示されている。この状態で登録されたデータをもとにして処理が行われる。

次に、プローブの進入方向、進入位置、および

以下、本発明の一実施例を図面に基づいて説明する。

第1図は本発明の自動プログラム作成装置を使用した三次元測定システムの構成図である。

二次元C A D装置であるM I C R O・C A D A M Iには測定対象物7を三面図で表わした図面が登録されており、この図面に測定対象物7の輪郭測定位置と測定条件データが記載されている。これら測定対象物7の輪郭測定位置と測定条件データは対話方式で、コンソール2によりスタンドアロン形式のM I C R O・C A D A M Iを含むコンピュータからなる自動プログラム作成装置3へ入力され、自動プログラム作成装置3は、入力した上記データおよびコンソール2より入力されるデータをもとにプローブの進入方向、進入位置、およびアプローチ位置のXYZ座標を演算して移動軌跡データを求め、C N C三次元測定機6で自動輪郭測定を行うパートプログラム4を作成し、また上記移動軌跡データに基づいてパートプログラム4の移動軌跡をC N C三次元測定機6でシミュレーションする

アプローチ位置のXYZ座標の演算例について説明する。

第3図はある1つの測定ラインのプローブの進入と測定の動作位置を断面図で示したものである。

第2図のM I C R O・C A D A M Iに登録されたデータより取り出すのは、終了点EのXYZ座標と開始点DのXY座標のみで、終了点Eと開始点DのZ位置の差異 $\alpha$ と、開始点から進入位置Bまでの距離 $\beta$ と、進入方向を示す位置Cの開始点Dからの距離(以下、にげ量と記す) $r$ は、デフォルト値で設定するか、もしくは対話入力でコンソール2から設定を行う。アプローチ位置Aと進入位置BのXYZ座標を、開始点DのXY座標と、終了点EのZ座標と、差異 $\alpha$ と、進入までの距離 $\beta$ で計算し求める。

また、進入の方向を示す位置CのXYZ座標を、開始点DのXY座標と、終了点EのZ座標と、開始点Dからのにげ量 $r$ と、差異 $\alpha$ より求める。差異 $\alpha$ の値と、進入距離 $\beta$ の値と、開始点Dからのにげ量 $r$ の値は、測定対象物7の形状や測定条件

などによって、最も適した値となるようにそのつど対話形式で入力設定ができる。

このように求めたアプローチ位置A、進入位置B、進入方向を示す位置Cの座標と開始点Dと終了点Eの座標から移動軌跡データを形成し、CNC三次元測定機6で自動輪郭測定を行うパートプログラムを作成できる。

また、アプローチ位置Aから進入、方向性を示す位置までのテストプログラムも上記移動軌跡データから形成することができる。

第4図は、測定時、測定対象物7に接触して測定を行うプローブのアプローチから終了までの動作を示したもので、第4図(a)は通常の測定を行なうときの動作軌跡で、第4図(b)は処理によりパートプログラムと一緒に作成される、パートプログラム移動テストプログラムを動作させたときの軌跡である。

第4図(b)に示すように、テストプログラムによりアプローチから進入、方向性を示す位置までの移動をすべての測定ラインに対して、実際にシミュレーションが行えるため、測定の動きを事前チェックできる。

このように自動輪郭測定を行うパートプログラムとテストプログラムを作成し、テストプログラムにより事前に動作を確認することができることにより、三次元測定機6による長時間無人測定を実現でき、人が三次元測定機6についている必要がなくなり、作業の効率の向上をはかることができる。また多くの位置の測定データを採取することにより、より正確な測定を行うことができる。さらに、二次元CAD図面情報をもとにデータを抽出するため、設計者が容易に測定位置を直接指示することができる。

発明の効果

以上のように本発明によれば、二次元CAD情報に書かれた測定位置、測定条件を入力し、これをもとにアプローチ位置、進入位置などのXYZ座標を計算して三次元測定機で輪郭測定するパートプログラムを作成し、測定動作を事前にシミュレーションするテストプログラムを作成することにより、より正確な測定を行うことができる。また多くの位置の測定データを採取することにより、より正確な測定を行うことができる。さらに、二次元CAD図面情報をもとにデータを抽出するため、設計者が容易に測定位置を直接指示することができる。

発明の効果

以上のように本発明によれば、二次元CAD情報に書かれた測定位置、測定条件を入力し、これをもとにアプローチ位置、進入位置などのXYZ座標を計算して三次元測定機で輪郭測定するパートプログラムを作成し、測定動作を事前にシミュレーションするテストプログラムを作成することにより、より正確な測定を行うことができる。また多くの位置の測定データを採取することにより、より正確な測定を行うことができる。さらに、二次元CAD図面情報をもとにデータを抽出するため、設計者が容易に測定位置を直接指示することができる。

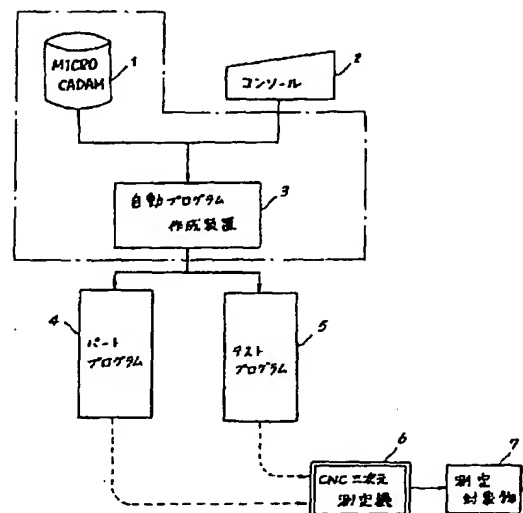
により、二次元CAD図面情報をもとにデータを抽出するため、設計者が容易に測定位置を直接指示することが可能となり、さらにテストプログラムにより、動作の事前確認ができるために、三次元測定機の長時間無人稼働が実現され、測定時間の短縮および作業の効率化をはかることができる。また、多くの位置の測定データが採取されることにより、より正確な測定を行うことができる。

#### 4 図面の簡単な説明

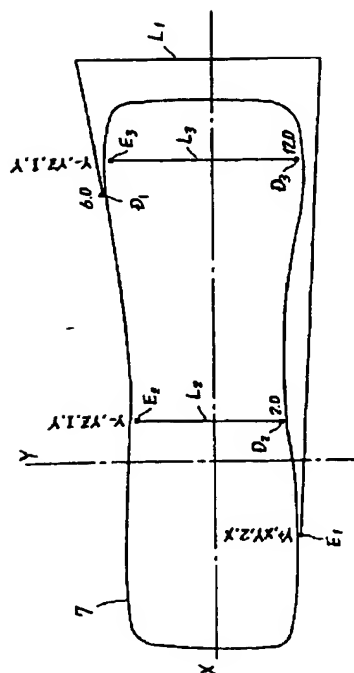
第1図は本発明の自動プログラム作成装置を使用した三次元測定システムの構成図、第2図は二次元CADの測定対象物の図面に測定位置と条件を指示した図、第3図は測定ラインのプローブの進入と測定の動作位置を断面図で示した図、第4図(a)、(b)はそれぞれ測定時とシミュレーション時のプローブの動作軌跡を示した図である。

1…MICRO・CADAM(二次元CAD)、2…コンソール、3…自動プログラム作成装置、4…パートプログラム、5…テストプログラム、6…CNC三次元測定機、7…測定対象物。

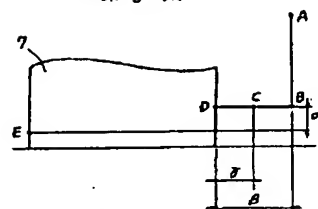
第1図



第2区

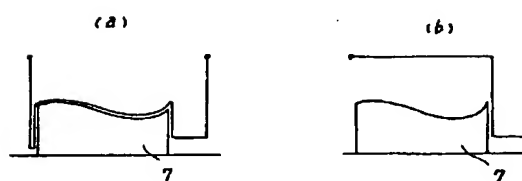


第 3 図



A…アプロ位置  
B…進入位置  
C…進入方向を示す位置  
D…開始点  
E…終了点

· 第 4 回



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 03-288909

(43)Date of publication of application : 19.12.1991

(51)Int.Cl.

G05B 19/403

G05B 19/405

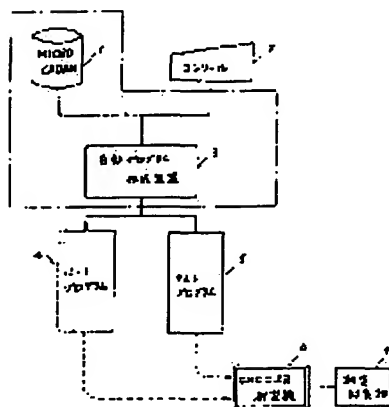
(21)Application number : 02-091603

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO  
LTD

(22)Date of filing : 05.04.1990

(72)Inventor : SAWADA MIHOKO  
JODAI HIROMICHI

## (54) AUTOMATIC PROGRAM PREPARING DEVICE



ness by preparing a part program to execute an automatic  
ram and confirming operations according to the test

ata and data to be inputted from a console 2, an  
finds movement track data by operating the approach  
robe and the XYZ coordinates of the approach position,  
e the automatic contour measurement by a CNC  
dimensional measuring machine 6 and prepares the test  
rack of the part program 4 by the CNC three-  
d on the movement track data. According to these two  
ial measuring machine 6 automatically measures the  
d executes the simulation. Thus, since the operations can  
dvance, the work can be made efficient.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of  
rejection]

[Kind of final disposal of application other than  
the examiner's decision of rejection or  
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision  
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office